

maleki@alzahra.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۸؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۰/۸/۱۳۹۱)

است، مورد مطالعه قرار گرفته است [۱]. نمونه‌هایی از آن هم در علوم غیر خطی و هم در کاربردهای فن آوری آشکار می‌شود. که از آن جمله می‌توان به رشد کریستالی^۱، جابه‌جایی سیال در محیط متخلخل^۲، رسوب الکتروشیمیایی^۳، انتشار شعله^۴ و غیره اشاره کرد [۲ و ۳]. مسئله سافمن- تیلور، عموماً به طرح‌های انگشتی و شکسان در سلول هل- شاو اشاره دارد [۴]. ناپایداری سافمن- تیلور زمانی روی می‌دهد که سیالی با وشكسانی کمتر از طریق حفره‌ای به لایه نازکی از سیالی دیگر

۱. Crystal growth

۲. Fluid displacement in porous media

۳. Electrochemical deposition

۴. Flame propagation

دینامیک سطح مشترک حدود نیم قرن است که با نگاشت همدیس بررسی می‌شود. این مسئله در ابتدا با مدل‌های طرح‌های انگشتی و شکسان^۱ و انجاماد درختی^۲ شروع شد و مطالعات بعدی در علم مواد شامل مهاجرت الکتریکی حفره در فلزات^۳ بود. مسئله سافمن- تیلور به مدت چهار دهه به طرز وسیعی به عنوان الگوی اصلی در مسئله مرز- متحرک که مربوط به کلاس گسترده حل‌های ناپایداری‌های ریخت شناسی و شکل گیری الگوی فصل مشترک در فیزیک‌های غیر تعادلی

۱. Viscouse fingering

۲. Dendritic solidification

۳. Void electro-migration

اگر $(z_0) f'$ مخالف صفر باشد اندازه dw برابر است با $|f'(z)|dz$ و شناسه^۱ آن برابر است با مجموع شناسه dz و شناسه $(z_0) f'$. یعنی اگر $(z_0) f'$ مخالف صفر باشد، هر خطی که از نقطه z_0 می‌گذرد در صفحه w به اندازه شناسه $(z_0) f'$ می‌چرخد. چون این نتیجه برای هر خطی که از z_0 می‌گذرد برقرار است. بنابراین زاویه بین دو خط تحت هر تبدیلی با فرض $\neq (z_0) f'$ ثابت می‌ماند. به این گونه تبدیل‌ها که در آنها زاویه حفظ می‌شود، همدیس^۲ گفته می‌شود.

نگاشت همدیس به دلیل کاربردش در حل معادله لایپلاس از اهمیت خاصی برخوردار است. تعریف نگاشت همدیس روشی برای حل معادله لایپلاس در هندسه‌های مختلف ارائه می‌دهد. این نگاشت برای سیالات تراکم ناپذیر که در معادله لایپلاس صدق می‌کنند به کار می‌رود. فرض می‌کنیم نگاشت همدیس $z = f(z, t)$ وجود دارد که به وسیله آن ناحیه‌ای از صفحه z به ناحیه‌ای از صفحه w نگاشته می‌شود. حل معادله لایپلاس در ناحیه مذکور با شرایط مرزی داده شده در صفحه z ، به روش تحلیلی امکان پذیر نیست ولی در صفحه w حل این معادله ساده است. تحلیل ریاضی ساختارهای ریز نوعاً مشکل است ولی در دو بعد با استفاده از آنالیز مختلط تعدادی از مسائل قابل بررسی هستند. مسائل مرز آزاد متتحرک^۳ با استفاده از نگاشت همدیس به خوبی فرمول بنده می‌شوند. این مدل ابتدا با طرح‌های انگشتی و شکسان و انجام درختی [۷] شروع شد و مطالعات بعدی در علم مواد شامل مهاجرت الکتریکی حفره در فلزات [۸ و ۹] بود. در دهه گذشته نگاشتهای همدیس برای مسائل تصادفی مانند انبوهش محدود به پخش [۱۰ و ۱۱] و شکست دی الکتریک^۴ [۱۲ و ۱۳] نیز استفاده شده است. معادله حاکم بر پدیده‌های ذکر شده، معادله پخش است که این معادله در تقریب شبه-مانا به معادله لایپلاس تبدیل می‌شود. در این مسائل متتحرک بودن مرز باعث پیچیده‌تر شدن حل معادله

با وشکسانی بیشتر (که بین دو صفحه موازی و شفاف نگهداری می‌شود) تزریق شود. در این سلول که به سلول هل-شاو معروف است، توزیع فشار از معادله لایپلاس پیروی می‌کند.

در حالت کلی دینامیک سیالات از معادله ناویر-استوکس پیروی می‌کند. حل این معادله در حالت کلی بسیار پیچیده است. به همین خاطر هل-شاو^۵ (۱۸۵۴-۱۹۴۱) مطالعات زیادی بر روی سیالات به منظور یافتن معادلاتی با جواب‌های قابل دسترس در شرایط ساده‌تر انجام داد.

او در سال ۱۸۹۸ سلول معروف خود را اختراع کرد، برای این کار از صفحات شیشه‌ای که با فاصله مناسبی روی یکدیگر قرار گرفته بودند (0.2 in) و جریان بین آنها در تمام سرعت‌ها لایه‌ای بود، استفاده کرد [۵]. در این سلول خطوط جریان قابل مشاهده می‌باشند [۶]. معادله پیچیده ناویر-استوکس که مربوط به حرکت سیال تراکم ناپذیر است در این سلول به روابط ساده زیر تبدیل می‌شوند:

$$(1) \quad U = -\left(\frac{d^2}{12\eta}\right)\nabla p, \quad \nabla \cdot U = 0, \quad \nabla^2 p = 0,$$

که در آن U سرعت سیال، p فشار، d فاصله بین دو صفحه شیشه‌ای و η وشکسانی سیال است.

نکته جالب در مورد این معادلات این است که در دو بعد می‌توان آنها را با استفاده از نگاشت همدیس حل کرد، ابزاری که ما از آن برای مطالعه نقش‌های انگشتی در سلول هل-شاو استفاده کردیم.

فرض می‌کنیمتابع $(z) f = w$ ، یک تابع تحلیلی باشد. در این صورت هر نقطه از صفحه z با تبدیل $(z) f$ به یک نقطه در صفحه w نگاشته می‌شود. تغییر dz حول نقطه z معادل تغییر حول نقطه w است.

$$(2) \quad z = x + iy.$$

۱. Argument

۲. Conformal

۳. Moving free boundary

۴. Dielectric breakdown

۵. Hele-shaw

$$v = -\left(\frac{k}{\mu}\right) \nabla p, \quad (3)$$

که k ضریب تراوایی و μ ضریب وشکسانی است. این معادله در واقع همان معادله هل-شاو است. فشار روی سیال دوم تقریباً ثابت است. در تقریب شبه-مانا، فشار در معادله لاپلاس صدق می‌کند.

نقش طرح‌های انگشتی وشکسان به خوش‌های تولید شده با مدل انبوهش محدود به پخش (DLA) شباهت دارد. گرچه معادله حاکم بر دو مسئله یکسان است ولی تفاوت‌هایی وجود دارد. در طرح‌های انگشتی وشکسان مرز نقش به طور پیوسته رشد می‌کند و تمام نقاط مرز همزمان جای‌جا می‌شوند. در صورتی که در مدل DLA رشد تصادفی است و ذرات تک تک اضافه می‌شوند.

یک سلول هل-شاو با عرض $w = 2\pi$ در جهت محور y با گستردگی در جهت محور x ، که فاصله دو صفحه به اندازه b می‌باشد در نظر می‌گیریم. میدان سرعت متوسط یک جریان پتانسیل دو بعدی است از قانون دارسی پیروی می‌کند [۴]

$$v = \nabla \phi, \quad (4)$$

که در آن پتانسیل سرعت با فشار با رابطه $p = -\frac{b^2}{12\mu} \phi$ ، مرتبط است. μ وشکسانی است و فرض می‌شود که سلول افقی باشد و آثار گرانش وجود نداشته باشد. اگر سیال را تراکم ناپذیر فرض کنیم ($\nabla \cdot v = 0$) و معادله لاپلاس به صورت زیر به دست می‌آید [۱۶ و ۱۷]:

$$\nabla^2 \phi = 0, \quad (5)$$

شرطی مرزی در فصل مشترک به صورت زیر هستند [۴]:

$$\phi|_{\Gamma} = d.k|_{\Gamma}, \quad (6)$$

$$v_n = \hat{n} \cdot \nabla \phi, \quad (7)$$

$$(\nabla \phi)_n = \left[\frac{\partial \Gamma}{\partial t} \right]_n, \quad (8)$$

که Γ نشان دهنده مرز متحرک یا فصل مشترک و k انجنا است. \hat{n} بردار واحد عمود بر سطح و d کشش سطحی بدون بعد است که با رابطه زیر بیان می‌شود:

لاپلاس می‌شود. نگاشت‌های همدیس وابسته به زمان ابزاری مناسب برای بررسی این پیچیدگی‌ها است. از نگاشت‌های وابسته به زمان در تحلیل رشد لاپلاسی با دینامیک پیوسته استفاده می‌شود. همچنین با استفاده از نگاشت همدیس مکرر نقش‌های فراکتالی (دینامیک گستره) تولید شده و خواص مقیاس بندی آنها مطالعه شده است.

در ادامه به تعدادی از مسائل فیزیکی این فرآیند اشاره می‌شود.

در این پدیده انجامد با یک بذر در دمای $T < T_{melt}$ که در مایع با دمای $T > T_{melt}$ قرار دارد شروع می‌شود. اگر آهنگ انجامد آهسته باشد می‌توان تقریب شبه-مانا را به کار برد و مسئله به حل معادله لاپلاس برای مرز متحرک تبدیل می‌شود که در این حالت مرز با سرعتی متناسب با ∇T حرکت خواهد کرد.

سیستم از یک الکترولیت شامل یون‌های فلزی مثبت با چگالی کم و یک الکترود منفی تشکیل شده است. در هر لحظه یک یون مثبت به صورت تصادفی با الکترود برخورد کرده و به واسطه جاذبه الکتریکی به آن می‌چسبد و شکل نهایی الکترود یک ساختار شاخه-شاخه است. معادله حاکم بر این پدیده نیز معادله پخش می‌باشد. که در تقریب شبه-مانا به معادله لاپلاس تبدیل می‌شود. که در آن C ، چگالی یون‌های فلزی مثبت می‌باشد. و آهنگ رشد با ∇C متناسب است [۱۴].

سافمن^۱ و تیلور^۲ یک سیستم شبه دو بعدی را بررسی کردند که در آن سیالی با وشکسانی کمتر به درون صفحه شیشه‌ای مسطح (سلول هل-شاو) که با سیالی با وشکسانی بیشتر پر شده است، تزریق می‌شود. مطابق قانون دارسی که سرعت سیال را در محیط متخلف بر حسب گرادیان فشار به دست می‌دهد [۱۵]، مرز سیال با سرعت زیر حرکت می‌کند:

۱. Saffman

۲. Taylor

ایده اين است که ديناميکها را از نظر معادله تکامل یافته برای نگاشت وابسته به زمان (w, t) f توصيف کنيم.

معادله تکاملی برای نگاشت به صورت زير می باشد [۴ و ۱۶]:

$$\partial_t f(w, t) = w \partial_w f(w, t) A \left[\frac{\operatorname{Re}(w \partial_w \Phi(W))}{|w \partial_w f(w, t)|^2} \right], \quad (10)$$

$A[h]$ يك عملگر صحیح است که بر تابع حقیقی تعريف شده روی دایره واحد عمل می کند، (h, ϕ) ، با يك بسط فوريه به صورت زير بيان می شود [۱۶]:

$$h(\phi) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n e^{in\phi} + a_n^* e^{-in\phi} \right], \quad (11)$$

به منظور به دست آوردن يك معادله برای نگاشت پس از معادله (۱۰) باید پتانسیل مختلط (w) $\Phi(w)$ را به f ربط دهیم. اين کار به طور کلی نه تنها به هندسه بلکه به حرکت نسبی چهارچوب مرتع نیز بستگی دارد. به اين خاطر است که هنگامی که ما يك ديسک (منطقه محدود) را به يك منطقه نامتناهی نگاشت می دهيم نقاط تکينگی برای نگاشت تا بینهايت $(w=0)$ اتفاق می افتد. برای هندسه نوار نیمه نامتناهی در کanal با $w=2\pi$ ساختار کلی برای $f(w)$ به شكل زير می باشد:

$$f(w, t) = -\ln w + \tilde{f}(w, t), \quad (12)$$

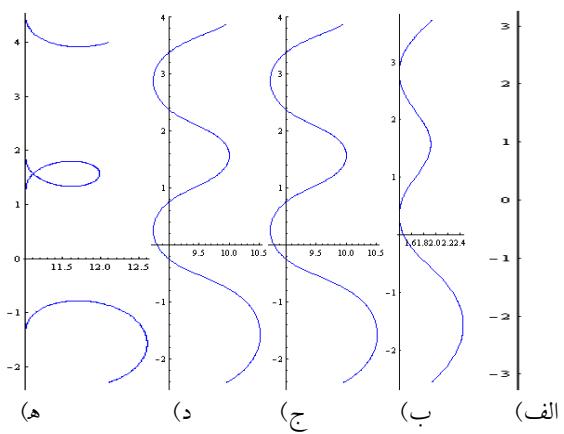
که $\tilde{f}(w)$ يك تابع تحليلي در ديسک واحد است. فصل مشترک Γ بين دو سیال، تصویری از دایره واحد $(w = e^{i\phi})$ تحت نگاشت $f(w, t)$ می باشد و داريم:

$$\Gamma(t, \phi) = f_t(e^{i\phi}), \quad (13)$$

نگاشت $f(w, t)$ در زمان t فصل مشترک $\Gamma(t, \phi)$ را بيان می کند. در صفحه w (داخل ديسک واحد) قسمت حقیقی تابع تحليلي $\Phi(w)$ در مرز $(w = e^{i\phi})$ با $\phi(w) = d_s k(\phi)$ معین می شود. برای اين که تابع Φ تحليلي شود، قسمت موهومنی آن باید مزدوج همساز قسمت حقیقی آن باشد. بنابراین از رابطه پواسون استفاده می کنيم. در چهارچوب آزمایشگاه و با در نظر گرفتن $v_\infty = 1$ ، پتانسیل مختلط داري رابطه زير است:

$$\Phi_L(w) = -\ln w + d_s A[k], \quad (14)$$

جمله اول تابع Φ حل برای پتانسیل در غياب کشش سطحي



شکل ۱. طرح های انگشتی در حالت فصل مشترک مسطح با در نظر گرفتن عامل زمان برای رشد انگشت ها به ترتیب برای (الف) $\{t=0, \alpha'=0, \alpha''=0\}$ ، (ب) $\{t=2, \alpha'=0.08, \alpha''=0.05\}$ ، (ج) $\{t=1, \alpha'=0.07, \alpha''=0.05\}$ و (ه) $\{t=4, \alpha'=0.082, \alpha''=0.085\}$. (د) $\{t=3, \alpha'=0.082, \alpha''=0.06\}$ و (ه) $\{t=3, \alpha'=0.082, \alpha''=0.06\}$ به ازای $|z(t)| \leq 1$ ، شکل ها از نظر فيزيکي قابل قبول هستند اما در شکل (ه) اين شرط برآورده نشده است. بنابراین از نظر فيزيکي قابل قبول نیست.

$$d_s = \frac{\sigma b^2 \pi^2}{12 w^3 \mu v_\infty}, \quad (9)$$

که در آن v_∞ سرعت سیال در بینهايت است. w عرض کanal است که معمولاً 2π درنظر گرفته می شود و μ وشكسانی سیال رانده شده می باشد. معادله (۶) جهش فشار لاپلاس برای يك فصل مشترک خمیده در تعادل محلی و معادله (۷) شرط پیوستگی حرکت فصل مشترک است. در اينجا فرض می کنیم شرایط مرزی روی دیواره های جانبی تناوبی است. سه معادله تا (۵) به طور کامل مسئله را مشخص می کند.

هندسه دو بعدی به همراه زمينه های مربوطه به صورت هماهنگ و واضح نشان می دهند که صورت بندی متغير مختلط بسيار مفيد است. به ويزه استفاده از تكنيك های نگاشت همديس برای فرمول بندی مسئله بسيار مفيد می باشد [۴]. برای اين کار نگاشت همديس $(w = f(z))$ يك منطقه مرتع در صفحه w را تعريف مي کند. برای مثال می توان به نگاشت ديسک واحد $|w| \leq 1$ ، به منطقه اشغال شده به وسیله سیال وشكسان در صفحه مختلط $z = x + iy$ اشاره کرد (شکل (۱)), به گونه ای که دایره واحد $w = e^{i\phi}$ به رابطه بين دو سیال نگاشته شود. تابع نگاشت شامل تمام اطلاعات هندسي مربوط به رابط می باشد.

این حل‌ها از تکینگی‌های زمان محدود آزاد می‌باشند و بنابراین فصل مشترک پیوسته هموار است [۲۰ و ۲۱]. نگاشتهای تعریف شده با معادلات (۱۹)، (۲۰) یا ترکیبی از هر دو، حل‌های معادله (۱۸) هستند. به این معنی که دینامیک حاکم بر مسئله به مجموعه متناهی از پارامترهای ظاهر شده در معادله نگاشت کاهش می‌یابد. محدودهای از α که از نظر فیزیکی معنی دار است به صورت $|\alpha_j| \leq 1$ است (فضای فاز را متراکم می‌کند). حل N لگاریتمی معادله (۲۰) شامل شرایط اولیه‌ای است که نوک انگشت با یک زیر مجموعه از α رشد می‌کند [۲۲]. شکل تحلیلی نگاشت تنها به تعداد محدودی از پارامترهای وابسته به زمان برای توصیف تحول زمانی نیازمند می‌باشد.

هدف ما پیدا کردن حل‌های صریح هموار (بدون نقاط تکین زمان محدود) است که این حل‌ها شامل سه نوع فیزیکی: فصل مشترک مسطح، طرح‌های انگشتی منفرد، طرح‌های انگشتی دوتایی مشکل از تکرار حل طرح‌های انگشتی منفرد (دو انگشت برابر) می‌باشند.

ساده‌ترین کلاس از حل‌ها که نیاز به این سه دسته را برآورده می‌کند از نظر فرمول بندی نگاشت همدیس به صورت زیر است [۲۳]:

$$f(w,t) = -\ln w + d(t) + (1-\lambda) \ln(1-\alpha(t)w) + (1-\lambda) \ln(1+\alpha(t)^* w), \quad (21)$$

که در آن $\alpha'(t) + i\alpha''(t) = \alpha'(t) + i\alpha''(t)$ است. این رابطه به طور کلی دو انگشت متفاوت سیال با وشکسانی کم که در سیالی با وشکسانی زیاد نفوذ می‌کنند را بیان می‌کند. این انگشت‌ها متقارن هستند و پیشروی ندارند [۱۶ و ۱۷]. انگشت‌ها به صورت متقارن در طول دو محور ثابت حرکت می‌کنند اما این حالت هیچ محدودیت ضروری را معرفی نمی‌کند. به خصوص درک این که چنین تقارنی از رقابت طرح‌های انگشتی در مسئله منظم جلوگیری نمی‌کند، اهمیت دارد.

حالات متعلق به طرح‌های انگشتی منفرد با شکلی

می‌باشد. k عملگر انحنا است که با توجه به تابع نگاشت به صورت زیر داده می‌شود:

$$k = -\frac{1}{|\partial_\phi f|} \operatorname{Im}\left(\frac{\partial_\phi^* f}{\partial_\phi f}\right). \quad (15)$$

در چهارچوب متحرک تابع پتانسیل مختلط به صورت زیر می‌باشد [۱۵]:

$$\Phi_M(w) = -\tilde{f}(w) + d.A[k]. \quad (16)$$

اگر مسا معادله (۱۰) را مزدوج کنیم و آن را در $w \partial_w f(w,t) = i \partial_\phi f(\phi,t)$ ضرب کنیم و قسمت حقیقی آن را بگیریم و آن را برای $w = e^{i\phi}$ مشخص کنیم، معادله تکامل یافته‌ای برای نگاشت به صورت زیر به دست می‌آوریم [۱۶]:

$$\operatorname{Re}\left(i \partial_\phi f(\phi,t) \partial_t f^*(\phi,t)\right) = 1 - d \cdot \partial_\phi H_\phi[k], \quad (17)$$

رابطه بالا برای چهارچوب آزمایشگاهی می‌باشد و برای چهارچوب در حال حرکت رابطه زیر را داریم:

$$\operatorname{Re}\left(i \partial_\phi f(\phi,t) \left[1 + \partial_t f^*(\phi,t)\right]\right) = 1 - d \cdot \partial_\phi H_\phi[k]. \quad (18)$$

به استثنای حالت کلی حل مسئله سافمن-تیلور در بقیه جاهای این مقاله از چهارچوب مرجع در حال حرکت استفاده می‌کنیم. دو معادله (۱۷) و (۱۸) از نظر حل پذیر بودن سخت هستند. برای حالت $d = 0$ ، کلاس‌های عمومی از حل‌های صریح از معادلات فوق شناخته شده هستند. در اینجا دو خانواده اصلی از حل‌ها که در فضا متراکم هستند مورد مطالعه می‌گیرند [۱۶]. از یک طرف نگاشت چند جمله‌ای به صورت زیر می‌باشد:

$$f(w,t) = -\ln w + d(t) + \sum_{j=1}^N a_j(t) w^j, \quad (19)$$

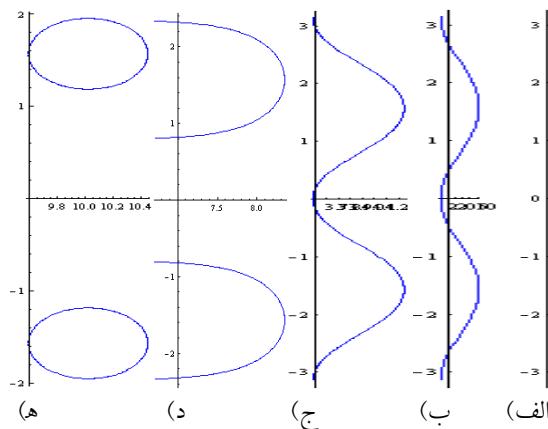
معادله بالا به صورت عمومی موجب تکینگی در نوک انگشت می‌شود [۲۰ تا ۲۳].

از طرف دیگر، یک کلاس عمومی حل به شکل زیر است:

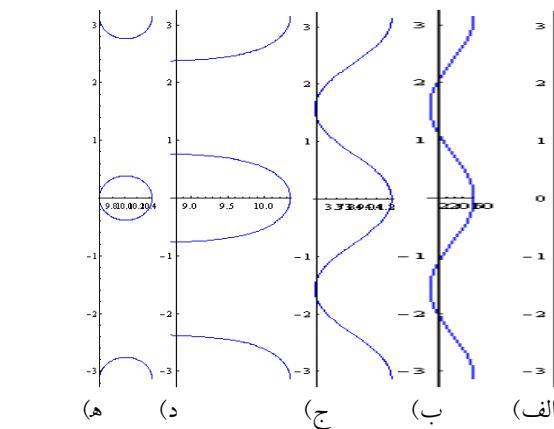
$$f(w,t) = -\ln w + d(t) + \sum_{j=1}^N \gamma_j \ln(1-\alpha_j(t)w), \quad (20)$$

که $\sum_{j=1}^N \gamma_j = 2(1-\lambda)$ محدودیت (۱۶) را می‌باشد که در آن λ کسری از کanal است که با انگشت‌ها

اشغال شده‌اند. در این مورد برای همه مقدارهای حقیقی از γ_j ،



شکل ۳. طرح های انگشتی دوتایی یکسان با در نظر گرفتن عامل زمان برای رشد انگشت به ترتیب برای زمان های (الف) $\{t=0, \alpha'=0\}$ و (ب) $\{t=2, \alpha'=0, 85\}$ و (ج) $\{t=1, \alpha'=0, 5\}$ و (د) $\{t=0, \alpha'=0, 42\}$ و (ه) $\{t=0, \alpha'=0, 20\}$. به ازای $|\alpha(t)| \leq 1$ ، شکل ها از نظر فیزیکی قابل قبول هستند اما در شکل (ه) این شرط برآورده نشده است. بنابراین از نظر فیزیکی قابل قبول نیست.



شکل ۲. طرح های انگشتی منفرد با در نظر گرفتن عامل زمان برای رشد انگشت به ترتیب برای زمان های (الف) $\{t=0, \alpha''=0\}$ و (ب) $\{t=2, \alpha''=0, 85\}$ و (ج) $\{t=1, \alpha''=0, 5\}$ و (د) $\{t=3, \alpha''=1\}$ و (ه) $\{t=4, \alpha''=0, 20\}$. به ازای $|\alpha(t)| \leq 1$ ، شکل ها از نظر فیزیکی قابل قبول هستند اما در شکل (ه) این شرط برآورده نشده است. بنابراین از نظر فیزیکی قابل قبول نیست.

در این طرح های انگشتی $\alpha' = 0$ می باشد بنابراین با گذشت زمان مقدار α'' زیاد می شود. برای رسم شکل از زمان های متفاوت و در نتیجه α'' های متفاوت استفاده می کنیم. که به ترتیب برای زمان های (الف) $\{t=0, \alpha''=0\}$ و (ب) $\{t=0, 5\}$ و (ج) $\{t=1, \alpha''=0, 85\}$ و (د) $\{t=2, \alpha''=1\}$ و (ه) $\{t=4, \alpha''=0, 20\}$ شکل ها رسم شده اند. نتایج در شکل ۲ آمده اند.

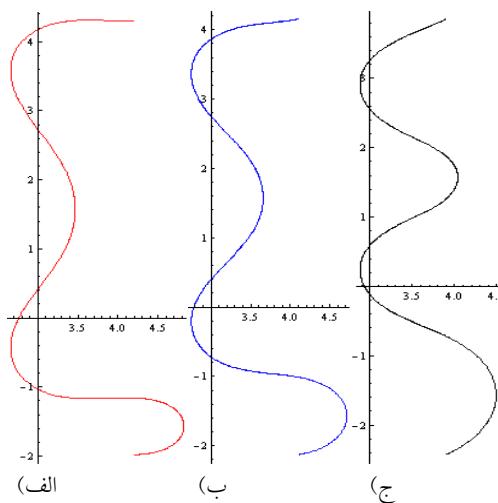
در این طرح انگشتی $\alpha'' = 0$ می باشد. بنابراین با گذشت زمان مقدار α' زیاد می شود و برای رسم شکل از زمان های متفاوت در نتیجه α' های متفاوت استفاده می کنیم. در شکل ۳، شکل ها به ترتیب برای زمان های (الف) $\{t=0, \alpha'=0\}$ و (ب) $\{t=0, 5\}$ و (ج) $\{t=1, \alpha'=0, 5\}$ و (د) $\{t=2, \alpha'=0, 85\}$ و (ه) $\{t=3, \alpha'=0, 42\}$ رسم شده اند.

به ازای ز های مختلف در معادله (۲۰) و اعمال شرط حاکم بر

متقارن است که در این حالت $\alpha''(t) = 1$ است. حالت متعلق به دو انگشت یکسان است وقتی $\alpha'(t) = 1$ باشد. برای معادله (۲۱) یک اختلال سینوسی از فصل مشترک مسطح را توصیف می کند. λ یک ثابت حرکت است و مقادیری حقیقی در بازه $[1, 0]$ می گیرد. در واقع λ کسری از کانال است که به وسیله انگشت های مهاجم اشغال می شود [۱۶ و ۱۷].

طرح های انگشتی دوتایی نا برابر به ازای زمان های متفاوت و در نتیجه $\alpha(t)$ متفاوت در شکل های زیر در محیط کامپیوتر رسم شده اند، که به ترتیب برای (الف) $\{t=0, \alpha'=0, \alpha''=0\}$ و (ب) $\{t=1, \alpha'=0, 7, \alpha''=0, 7\}$ و (ج) $\{t=2, \alpha'=0, 8, \alpha''=0, 8\}$ و (د) $\{t=3, \alpha'=0, 82, \alpha''=0, 82\}$ و (ه) $\{t=4, \alpha'=0, 85, \alpha''=0, 85\}$ رسم شده اند.

همان طور که در شکل ۱ دیده می شود به ازای $|\alpha(t)| \leq 1$ ، شکل ها از نظر فیزیکی قابل قبول هستند اما در شکل ۱ (ه) این شرط برآورده نشده است. بنابراین از نظر فیزیکی قابل قبول نیست [۱۶ و ۱۷].



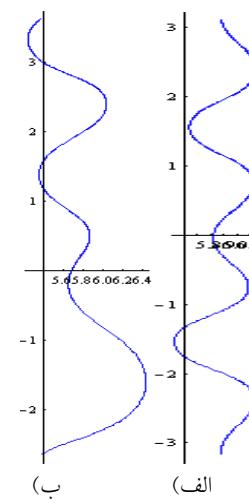
شکل ۵. رقابت بین دو انگشت نا برابر را برای $\alpha(t) = 0.85 + 0.4i$ و $\alpha_2 = 0.84 + 0.52i$ برای طرح‌های انگشتی دوتایی قبل از اعمال رشد و ب (ا) اعمال رشد $\epsilon = 0.2$ و (ب) با اعمال رشد $\epsilon = 0.3$ نشان می‌دهد. با افزایش مقدار ϵ انگشتی که جلوتر است بیشتر پیشروی می‌کند.

با معرفی $\epsilon \neq 0$ چهره فاز به طور چشمگیری تغییر می‌کند. این اختلال نشان می‌دهد که در رقابت در نهایت کدام انگشت زنده خواهد ماند. در شکل ۵ برای $\alpha(t) = 0.85 + 0.4i$ با اعمال $\epsilon = 0.2$ و $\epsilon = 0.3$ می‌توانیم رقابت موفقیت‌آمیز بین دو انگشت را نمایش دهیم.

نوع دیگری از اختلال را در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم که شامل یک جمله لگاریتمی اضافه به تابع نگاشت دو انگشتی غیر متقارن به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} f(w, t) = & -\ln w + d(t) + (1-\lambda) \ln(1-\alpha_1(t)w) \\ & + (1-\lambda) \ln(1-\alpha_2(t)w) \\ & + 2(\lambda - \lambda_s) \ln(1-\delta(t)w) \end{aligned} \quad (23)$$

برای $\delta \leq 1$ جمله لگاریتمی اضافه یک تغییر شکل کوچک دلخواه فصل مشترک بین دو سیال را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان نشان داد که اثر عبارت اضافی در زمان طولانی مهم است. هنگامی که δ به صورت یکنواخت با زمان رشد می‌کند، یک تغییر در محلوده کسر اشغال شده از کانال به وسیله انگشت‌ها، از λ به λ تولید می‌کند.



شکل ۴. (الف) سه انگشت وشکسان به ازای زمان $t = 3$ و $\alpha_1 = 0.2 + 0.89i$ ، $\alpha_2 = 0.84 + 0.52i$ و $\alpha_3 = 0.96 - 0.4i$. (ب) چهار انگشت وشکسان در زمان $t = 3$ و $\alpha_1 = 0.03 + 0.92i$ و $\alpha_2 = 0.05 - 0.95i$ و $\alpha_3 = 0.85 - 0.05i$ و $\alpha_4 = 0.83 - 0.02i$.

ثابت حرکت γ ، می‌توان تعداد زیادی انگشت را به دست آورد. به عنوان مثال طرح انگشتی سه تایی و طرح انگشتی چهارتایی با اعمال شرایط فوق رسم می‌گردند.

برای طرح سه انگشتی وشکسان در زمان $t = 3$ و $\alpha_1 = 0.2 + 0.89i$ و $\alpha_2 = 0.84 + 0.52i$ و $\alpha_3 = 0.96 - 0.4i$ شکل ۴ (الف) را داریم. برای طرح چهار انگشتی وشکسان در زمان $t = 3$ و $\alpha_1 = 0.05 - 0.95i$ و $\alpha_2 = 0.03 + 0.92i$ و $\alpha_3 = 0.83 - 0.02i$ و $\alpha_4 = 0.85 - 0.05i$ شکل ۴ (ب) را رسم کرده‌ایم.

در اینجا یک اختلال معرفی می‌کنیم که تقارن انگشت را بهم نمی‌زند اما احتمال پیشروی انگشت را بیان می‌کند. این نوع اختلال ویژگی جالبی دارد که رقابت موفقیت‌آمیز یک انگشت را بیان می‌کند. ایده ایجاد اختلال در مدل حداقل با معرفی ضرایب مختلط به شکل زیر می‌باشد [۱۶ و ۱۷]:

$$\begin{aligned} f(w, t) = & -\ln w + d(t) + (1-\lambda + i\epsilon) \ln(1-\alpha(t)w) \\ & + (1-\lambda - i\epsilon) \ln(1+\alpha(t)^* w). \end{aligned} \quad (22)$$

می‌توان نشان داد که پارامتر کوچک ϵ یک ثابت حرکت است که بیانگر سیستم دینامیکی جدید با ابعاد مشابه می‌باشد.

می کنیم [۱۶]. که $v_\infty = 1$ می باشد. سرعت U به λ ، کسر پر شده از کanal با عرض w توسط انگشت ها، با عبارت $U = \frac{1}{\lambda}$ ، مرتبط می باشد. برای راحتی نماد کشش سطحی بدون بعد را به صورت $d = \frac{\sigma b^2 \pi}{12 U w}$ تعریف می کنیم. در این شرایط معادله تکامل یافته (۱۰) به صورت زیر می شود:

$$\operatorname{Re}(i \partial_t f^* \partial_\phi f) = 1 - U d \partial_\phi H_\phi[k], \quad (24)$$

که در آن $H_\phi[k]$ تبدیل هیلبرت می باشد. نقطه شروع ما برای انتخاب مسئله معادله (۲۴) است. یعنی:

$$-U \frac{dy}{d\phi} = 1 - U d \partial_\phi H_\phi[k] \quad (25)$$

که در آن از این عبارت که $\frac{1}{\lambda} \partial_t f^* = U$ است، استفاده کردہ ایم. از معادله فوق نسبت به متغیر ϕ انتگرال گیری می کنیم که این کار اجازه می دهد ناپیوستگی های پرش از u به عنوان فاصله بین انگشت ها حساب شود. بنابراین داریم:

$$-U y(\phi) = \phi - U d \partial_\phi H_\phi[k] + c(\phi), \quad (26)$$

که $c(\phi)$ یک تکه ثابت است. در حالت یک انگشتی (ϕ) تنها ثابت در تمام بازه ϕ می باشد. برای حالت دو انگشتی، $c(\phi)$ دو مقدار در دو بازه (ϕ_1, ϕ_2) و (ϕ_2, ϕ_3) می گیرد. دو مقدار به اندازه مقدار محدود $(-U)^{\pi}$ با یکدیگر تفاوت دارند [۲۶ و ۲۷]. بعد از تبدیل هیلبرت معادله (۲۶) و استفاده از معادلات مربوط به تبدیل هیلبرت به دست می آوریم:

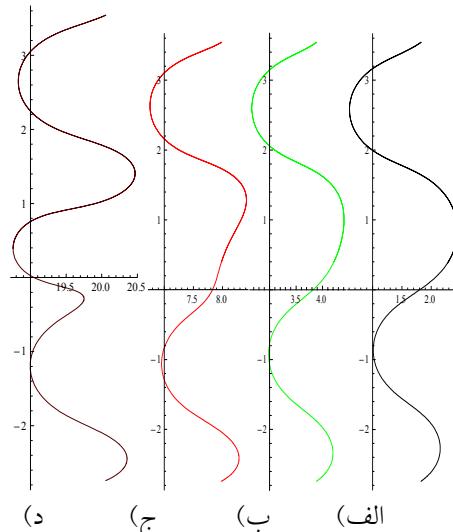
$$-d_k x(\phi) = x_c(\phi), \quad (27)$$

$$y(\phi) + \phi = \text{const} + H_\phi[x]. \quad (28)$$

که در آن معادله دوم چیزی جزی بیان تحلیلی از انجناست که به نگاشت $\tilde{f}(w) = f(w) + \ln w$ از طریق رابطه زیر مربوط می شود:

$$k = -\frac{1}{|\partial_\phi f|} \operatorname{Im}\left(\frac{\partial_\phi f}{\partial_\phi f}\right), \quad (29)$$

$x_c(\phi)$ ، حل برای حالت با کشش سطحی می باشد. برای حالت طرح های انگشتی منفرد، طرح های انگشتی سافمن- تیلور با عرض λ به صورت زیر اصلاح می شود:



شکل ۶. تغییر عرض انگشت برای دو انگشت نا متقابن برای $\alpha_1(t) = -0.5/88 + 0.4i$ و $\alpha_2(t) = -0.78/88 + 0.4i$ قبل از اضافه کردن اختلال و بعد از آن به ازای زمان های مختلف و در نتیجه افزایش مقدار δ ، با مقادیر (د) 0.99 و (ج) 0.6 و (ب) 0.2 و (الف) قبل از اختلال، تغییر عرض انگشت ها را از $1/3$ به $1/2$ داریم.

بی ثباتی کسر اشغال شده به علاوه یک نقطه تکین در بی نهایت مخصوص مورد دو انگشتی نیست بلکه کاملاً عمومی است. قابل توجه است که اتفاقاً این باعث می شود که هیچ امتیازی برای $\frac{1}{2} = \lambda$ به عنوان یک حالت ممتاز نباشد، به خاطر این که هیچ دلیلی برای انتخاب عرض انگشت خاص در حالتی که از کشش سطحی صرف نظر کرده ایم وجود ندارد [۲۴ و ۲۵].

برای ضرایب حقیقی از لگاریتم ها ما دوباره یک زنجیره از نقاط ثابت مربوط به λ_s داریم. به ازای $\alpha_1(t) = 0.5/88 - 0.4i$ و $\alpha_2(t) = -0.88/88 + 0.4i$ ، قبل از اضافه کردن اختلال و بعد از آن به ازای زمان های مختلف و در نتیجه افزایش مقدار δ ، با مقادیر (د) 0.99 و (ج) 0.6 و (ب) 0.2 ، تغییر عرض انگشت ها را از $1/3$ به $1/2$ داریم. همان طور که در نمودارهای در شکل ۶ دیده می شود در قسمت (ج) تغییر شکل رابط به خاطر نزدیک شدن مقدار δ به مقدار یک، کامل ترین حالت را دارا است.

در اینجا مسئله را در چهار چوب مرجع آزمایشگاه فرمول بندی

در زیر شکل‌هایی که از معادلات (۳۰ تا ۳۶) به دست می‌آیند را در محیط کامپیوتر در شکل‌های (۷ تا ۹) به تصویر کشیده‌ایم. برای این منظور ابتدا شکل‌های مربوط به معادله مرتبه صفر از معادلات (۳۵-۳۳) یعنی حالت‌های با کشش سطحی صفر را در شکل ۷ با استفاده از $x_0(\phi)$ و $y_0(\phi)$ مربوط به انگشت مورد نظر، برای حالت طرح‌های انگشتی منفرد، دو انگشتی، سه انگشتی و چهار انگشتی رسم می‌کنیم. شکل ۷ حاصل کار را نشان می‌دهد.

همان‌طور که در شکل‌های ۸ و ۹ دیده می‌شود، با افزایش مقدار d . نقش طرح‌های انگشتی ثانویه بزرگتر می‌شود. با توجه به معادله (۹) کشش سطحی بدون بعد با وشكسانی نسبت عکس دارد. به این دلیل در سلول هل-شاو، هر چه وشكسانی سیال اولیه (سیال با وشكسانی بیشتر) بیشتر باشد. آن کوچکتر و در نتیجه طرح‌های انگشتی ثانویه بزرگتری ایجاد می‌کند. در شکل برای سیال اولیه (سیال وشكسانی تر) از دو سیال آب و گلیسیرین در دمای اتاق استفاده شده است. چون وشكسانی گلیسیرین از آب بیشتر است در شکلی که در آن آب ماده اولیه (سیال با وشكسانی بیشتر) است، d . بزرگتر و در نتیجه طرح‌های انگشتی ثانویه بزرگتری را نسبت به شکلی که در آن گلیسیرین سیال اولیه (سیال با وشكسانی بیشتر) می‌باشد، می‌بینیم.

در این بخش اثر وشكسانی بر طرح‌های انگشتی را بررسی می‌کنیم. در شکل ۱۰ وشكسانی را در یک محدوده تغییر می‌دهیم و سپس طرح‌های انگشتی را در این محدوده و برای ابتدا و انتهای بازه وشكسانی رسم کرده‌ایم. مشاهده می‌کنیم که با افزایش وشكسانی طرح‌های انگشتی اضافه کاهش می‌یابد و دلیل آن تأثیر وشكسانی بر کشش سطحی بدون بعد است.

در این قسمت برای بیان تکامل انگشت‌های اضافه از معادله

$$x_0(\phi) = 2(1-\lambda) \ln \left(2 \sin \left(\frac{\phi}{2} \right) \right), \quad (30)$$

$$\text{با } y_0(\phi) = -\lambda(\phi + \text{const})$$

برای حالت دو انگشتی داریم [۲۶ و ۲۷]:

$$x_0(\phi) = (1-\lambda) \ln \left(2 |\sin \phi - \cos(p\pi)| \right), \quad (31)$$

که $p = \frac{\lambda}{\lambda}$ است و $y_0(\phi) = -\lambda(\phi + c(\phi))$ می‌باشد. این رابطه کلاس دو پارامتری از حل‌ها را نتیجه می‌دهد که ما آن را در معادله (۲۱) مدل حداقل نامیدیم.

در نهایت، ما آنالیزها را به ساختارهای N -انگشتی تعمیم می‌دهیم. که نتیجه آن به صورت زیر می‌باشد:

$$x_0(\phi) = \frac{2}{N} (1-\lambda) \ln \left(N \prod_{i=1}^N \sin \left(\frac{\phi - \phi_i}{2} \right) \right), \quad (32)$$

که $\phi_i = [(2j-1)/N - P_j]\pi$ ، ($j = 1, 2, 3, \dots$) می‌باشد و

$$\sum_{j=1}^N p_j = \frac{\lambda_j}{\lambda} \text{ است، با این قید که } p_j = 1 \text{ باشد.}$$

همان‌طور که در مرجع [۲۸] اشاره شده است، طرح اختلالی برای انگشت شدگی‌ها به صورت زیر می‌باشد:

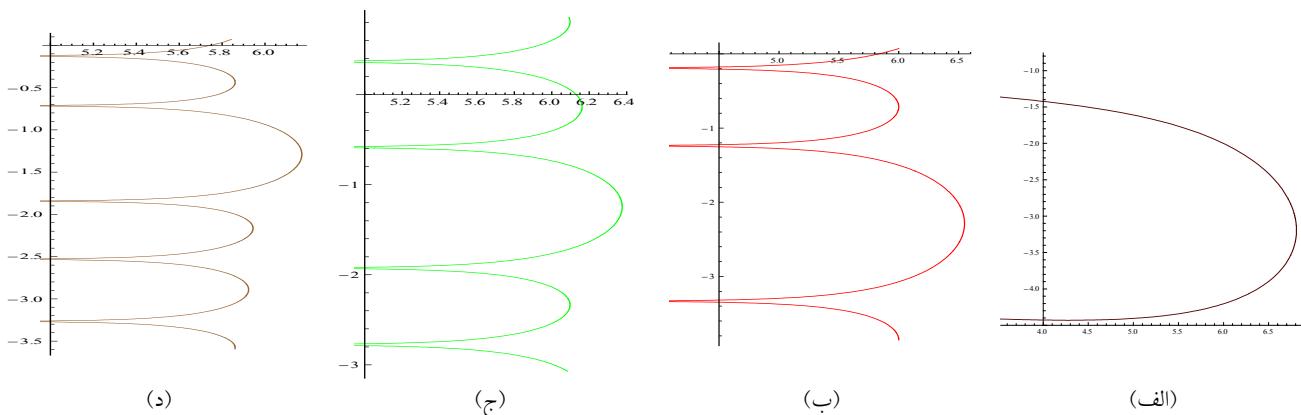
$$x(\phi) = \sum_n x_n(\phi) d^n = x_0(\phi) + d_1 x_1(\phi) + \dots, \quad (33)$$

$$y(\phi) = \sum_n y_n(\phi) d^n = y_0(\phi) + d_1 y_1(\phi) + \dots, \quad (34)$$

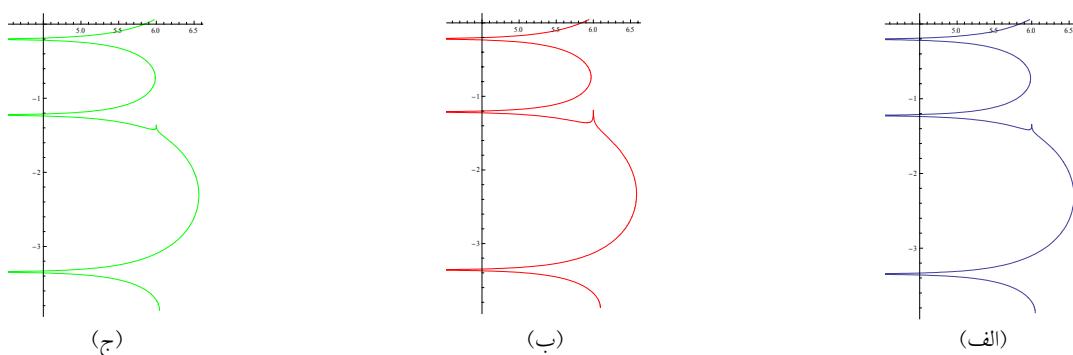
$$f(x) = Ut + x(\phi) + iy(\phi). \quad (35)$$

در حقیقت در مرتبه اول، $x_1(\phi) = k_1$ و $y_1(\phi) = H_\phi[x_1(\phi)]$ می‌باشد. که k_1 احناء برآورده شده از حل مرتبه صفر می‌باشد. در مرتبه‌های بعدی روابط بین پارامترها داده شده است. نقش منحصر به فرد کشش سطحی در پدیده انگشت شدگی، مسئول انتخاب این سازوکار است [۱۶]. و برای احناء داریم:

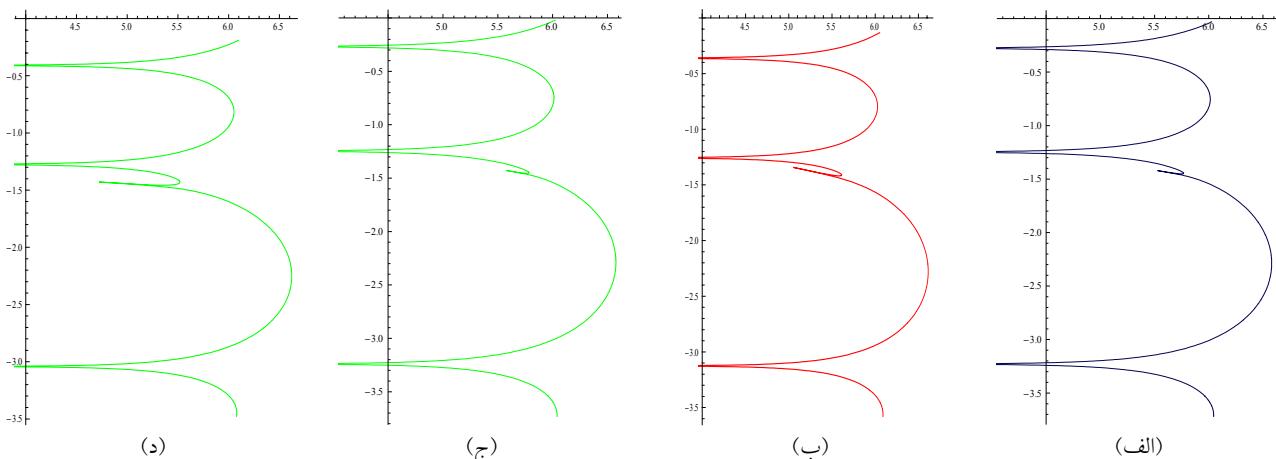
$$k(\phi) = k_0(\phi) + d_1 \frac{\partial_\phi y_0}{|\partial_\phi f_0|} \frac{d^\gamma x_1}{d\phi^\gamma} - d_1 \frac{\partial_\phi x_0}{|\partial_\phi f_0|} \frac{d^\gamma H_\phi[x_1]}{d\phi^\gamma} + \dots \quad (36)$$



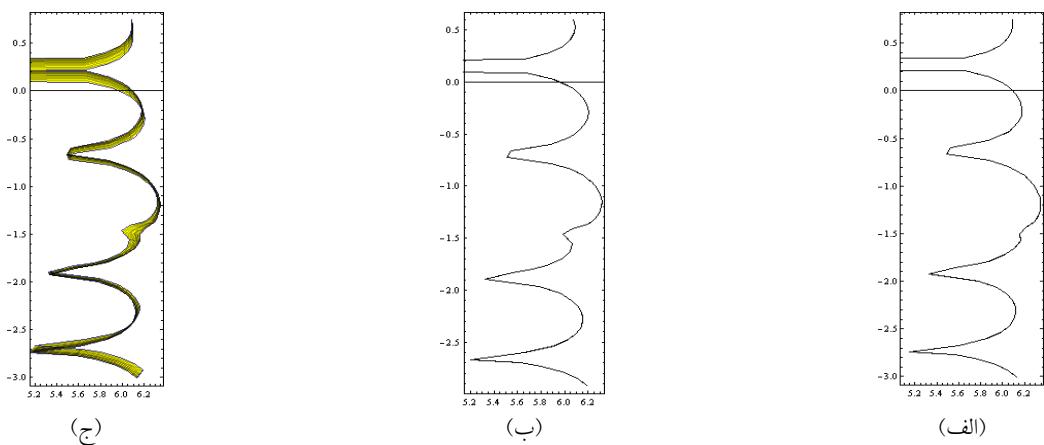
شکل ۷. الف) طرح های انگشتی منفرد ب) انگشت دو تایی (ج) سه انگشتی (د) چهار انگشتی برای حالت با کشش سطحی، مرتبه صفرم. این شکل ها بر اساس روابط ذکر شده x و y مشخص شده برای انگشت ها رسم شده اند.



شکل ۸. الف) انگشت دو تایی با $d = 0.01$ ، ب) انگشت دو تایی با $d = 0.02$ و ج) انگشت دو تایی با $d = 0.09$. با توجه به شکل ها برای d بزرگتر، نقش طرح انگشتی ثانویه بزرگتر می باشد.

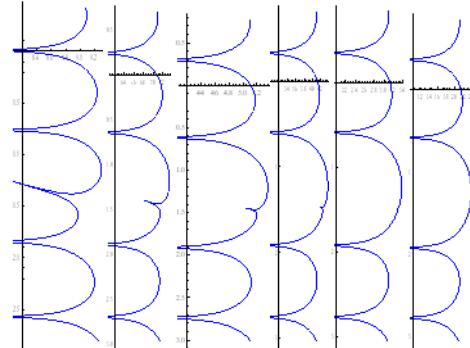


شکل ۹. الف) انگشت دوتایی با $d = 0.01$ با اعمال رشد $\epsilon = 3$ ، ب) انگشت دوتایی با $d = 0.02$ با اعمال رشد $\epsilon = 3$ (ج) انگشت دوتایی با $d = 0.09$ با اعمال رشد $\epsilon = 3$ و د) انگشت دوتایی با $d = 0.09$ با اعمال رشد $\epsilon = 9$. با اعمال رشد یکسان، انگشت ثانویه با d بزرگتر، رشد بیشتری دارد و با داشتن d یکسان در دو مورد (ج) و (د) با افزایش عامل رشد، انگشت ثانویه بیشتر رشد می کند.



شکل ۱۰. (الف) انگشت سه تایی در حد و شکسانی $\{0/94\}$ و (ب) در حد و شکسانی $\{0/4\}$ اثر تغییر و شکسانی در محدوده $\{0/94\}$ ، با در نظر گرفتن یک محدوده و شکسانی مشاهده می‌شود که با کاهش و شکسانی کشش سطحی بدون بعد افزایش یافته و نقش طرح انگشتی ثانویه رشد بیشتری می‌یابد.

در شکل ۱۱ این روند تکامل انگشت اضافه از چپ به راست برای $d_0 = 0.009$ و $N = 3$ مشخص شده است:



شکل ۱۱. انگشت ثانویه از چپ به راست برای $d_0 = 0.009$ و $N = 3$ به وسیله اعمال اختلال رشد به صورت تابعی از زمان تکامل می‌یابد. در واقع از چپ به راست با گذشت زمان، افزایش مقدار اختلال رشد و در نتیجه تکامل انگشت ثانویه مشاهده می‌شود.

در نهایت می‌توان گفت که ما در این کار با استفاده از نگاشت همدیس توانستیم طرح‌های انگشتی و شکسان در سلول مستطیلی هل-شاو را با استفاده از دو فرمول بنده متفاوت، ترسیم نماییم و اهمیت کشش سطحی را در ایجاد نقش‌های انگشتی مشاهده کنیم. سافمن و تیلور برای فرمول‌بنده طرح‌های انگشتی و شکسان از مقدار بسیار کوچک کشش سطحی صرف نظر کردند. به همین خاطر آنها مجموعه‌ای از حل‌های پیوسته را به دست آوردند که در حل آنها پدیده‌هایی چون رشد و رقابت انگشت‌ها به درستی بیان نشده بود. به همین علت از اختلال‌هایی برای جبران کمبود d_0 استفاده شد. این اختلال‌ها شامل اختلال رشد و اختلال تغییر عرض انگشت‌ها می‌باشند. اختلال رشد نشان می‌دهد که در رقابت بین انگشت‌ها در نهایت کدام انگشت برنده می‌شود و اختلال مربوط به تغییر عرض انگشت‌ها باعث تغییر عرض انگشت‌ها از مقدار λ به مقدار دلخواه λ_0 می‌گردد. با اعمال این اختلالات اگر چه فرمول بنده اولیه مسئله کامل‌تر می‌شد ولی این فرمول بنده برای ایجاد نقش‌های انگشت‌های ثانویه ناقص می‌باشد. دلیل این امر حذف کشش سطحی در معادلات بود. این مطلب بیانگر اهمیت نقش کشش سطحی در

مربوط به سه انگشتی همراه با کشش سطحی استفاده نموده‌ایم:

$$\begin{aligned} f(x) = & \frac{t}{\lambda} + \frac{2}{N} \left(\frac{1}{\lambda} \right) \log \left(2^N \left| \prod_{i=1}^N \sin \left(\frac{\phi - \phi_i}{2} \right) \right| \right) \\ & + d_0 (1 - \lambda + i\varepsilon(t)) (2\varphi) \\ & + 2i (-\lambda\varphi) + id_0 (1 - \lambda + i\varepsilon(t)) \\ & \times \left(-2 \log \left| 2 \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right) \right| \right). \end{aligned} \quad (37)$$

در معادله (۳۷) تعداد انگشت‌ها N ، $(1 - \lambda + i\varepsilon(t))$ اختلال رشد و d_0 بیانگر کشش سطحی بدون بعد می‌باشد. با استفاده از اختلال رشد به صورت تابعی از زمان توانستیم رشد انگشت‌های اضافه را با زمان به دست آوریم.

جملات بیشتری از معادله انحنای و استفاده از تبدیل هیلبرت این جملات در معادلات نگاشت، انگشت‌های اضافه بیشتری ایجاد می‌گردد.

مایلیم از دکتر شاهین روحانی بابت مشاوره‌های بی‌دریغشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم. همچنین باید از حمایت‌های دانشگاه البرهرا که این کار در آنجا انجام شد قدردانی کنیم.

مسئله طرح‌های انگشتی و شکسان است. اعمال مرتبه‌های مختلف از کشش سطحی باعث ایجاد نقش‌های طرح‌های انگشتی بیشتر و در نتیجه تکامل پدیده ایجاد طرح‌های انگشتی می‌شود، به طوری که ما با اعمال توامان این اختلال‌ها توانستیم تشکیل انگشت ثانویه را مشاهد کنیم که با این روش قبل مشاهده نشده بود. شکل‌های به دست آمده تا مرتبه اول اختلال با نمونه‌های اولیه مشاهده شده طرح‌های انگشتی در آزمایشگاه تطابق نسبتاً خوبی دارند. برای به دست آوردن نمونه‌های کاملتر از این پدیده شامل انگشت‌های بیشتر، پیشنهاد این است که با در نظر گرفتن

"خوش‌های کاتورهای تولید شده با نگاشت همداییس"
پایان‌نامه دکتری، دانشگاه صنعتی شریف.

15. T E Faber, "Fluid Dynamics For Physicists" Press Syndicate of the University of Cambridge (1995).
16. J Casademunt and F X Magdaleno, *Physics Reports* **337** (2000) 1.
17. E Paune, F X Magdaleno, and J Casademunt, *Phys. Rev. E* **65** (2002) 056213
18. B Shraiman and D Bensimon, *Physical Review A* **30** (1984) 2840.
19. S K Sarkar, *Physical Review A* **31** (1985) 3468.
20. S D Howison, *Journal of Fluid Mechanics* **167** (1986) 439.
21. S P Dawson and M Mineev-Weinstein, *Physica D* **73** (1994) 373.
22. B I Shraiman, *Physical Review Letters* **56** (1986) 2028.
23. F X Magdaleno and J Casademunt, *Physical Review E* **57** (1998) R3707.
24. J Casademunt and F X Magdaleno, *Physical Review Letters* **81** (1998) 5950.
25. R Almgren, *Physical Review Letters* **81** (1998) 5951.
26. F X Magdaleno and J Casademunt, *Physical Review E* **60** (1999) R5013.
27. F X Magdaleno and J Casademunt, in preparation.
28. J W McLean and P G Saffman, *Journal of Fluid Mechanics* **192** (1981) 455.

1. P G Saffman and G Taylor, "The Penetration of a Fluid into a Hele-Shaw Cell Containing a More Viscous Fluid" Proceeding the Royal of Society A **245** (1958) 312.
2. H P Pelce "Dynamics of curved fronts, perspectives in physics", Academic Press, New York (1988).
3. D A Kessler, J Koplik, and H Levine, *Advanced Physics* **37** (1988) 255.
4. D Bensimon, L Kadanoff, S Liang, B I Shraiman, and C Tang, *Review of Modern Physics* **58** (1986) 1.
5. P Coussot, *Journal of Fluid Mechanics* **380** (1999) 363.
6. A Vasilev, "Hele-Shaw Flows: Historical Overview", University of Bergen, Norway (2007), <http://robson.birs.ca/~07w5008/vasiliev.pdf>
7. L M Cummings, Y E Hohlov, S D Howison, and K Kornev, *Journal of Fluid Mechanics* **378** (1999) 1.
8. T Yoshikawa and A M Balk, *Physical Review Letters* A **251** (1999) 184.
9. D Crowdy, *Journal Application of Mathematica* **10** (1999) 623.
10. M B Hastings, *Physical Review E* **55** (1997) 135.
11. M B Hastings and L Levitov, *Physica D* **116** (1998) 244.
12. L Niemeyer, L Pietronero, and H J Wiesmann, *Physical Review Letters* **52** (1984) 1033.
13. M B Hastings, *Physical Review Letters* **87** (2001) 175502.
۱۴. فاطمه محمدی، (۱۳۸۹) "بررسی رفتار مقیاس‌بندی